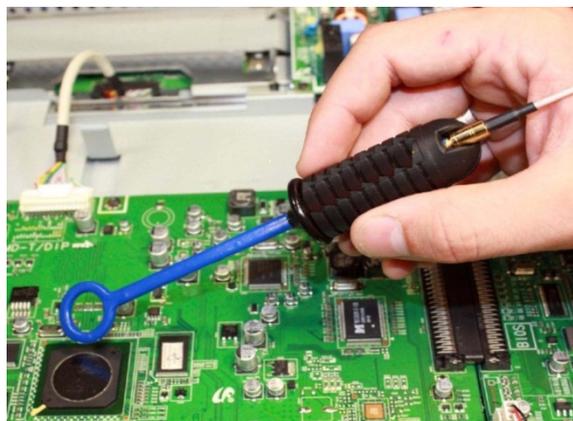
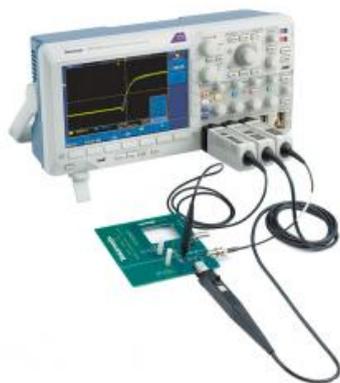


MDO EMI 诊断方案

应用产业：任何与电信号相关产业

应用行业：任何电子设备、电路板设计

应用技术：频谱分析、时域分析、跨域分析



EMI 定义：

电磁兼容（EMC）包括电磁干扰（EMI）和电磁抗扰度（EMS）两部分。简而言之，EMI 是电子设备对外部电磁环境的干扰，EMS 是电子设备抵抗外部电磁环境干扰的能力。无论是 EMI 还是 EMS，都包括辐射和传导两部分。EMC 认证是任何电子设备必须遵从的，EMI 是 EMC 中的重要部分。

EMI 测试：

EMI 测试包括如下几类：

1. EMC 认证机构在 EMC 实验室进行认证测试
2. 企业质检部门利用 EMI 接收机或高指标频谱仪进行 EMI 预认证测试
3. 产品研发、调测部门利用频谱仪进行 EMI 诊断
4. 产品研发调测部门利用示波器测试电源纹波、时钟抖动等特性，因为它们是产生 EMI 的因素之一。

EMI 诊断：

在电子设备设计、调试阶段，随时进行 EMI 诊断是保证电子设备通过 EMC 认证行之有效且费用最低的手段。如果最终产品 EMC 认证不合格，设计者需要重新进行 EMI 诊断，找出 EMI 问题的根源，但此时可用的整改手段已经不多，进行重新设计，费用将倍增。由此可见 EMI 诊断是日常工作中经常进行的，而 EMI 预认证以及认证测试只有在电子产品定型阶段才进行。有关 EMI 诊断预 EMI 预认证或认证的区别见下表。

	EMI 诊断	EMI 预认证/认证
目的	查找 EMI 问题的根源，消除或降低 EMI 问题的影响	确保最终产品符合 EMC 标准
对象	对屏蔽引起的 EMI 问题需进行整机测试，对其它 EMI 问题进行电路板级测试	最终产品整机测试

测试工具	电路板级测试用近场探头，整机测试用天线接收辐射干扰，或人工电源网络（LISN）接收传导干扰信号，用中低档频谱仪进行测试（通常在 6GHz 频段以下）。测试过程中一般用峰值检波。通常示波器经常被用来追踪 EMI 问题的根源（1GHz 示波器带宽足够）。	最终产品放置于屏蔽的 EMC 实验室中的可旋转测试台上，用天线接收辐射干扰，或人工电源网络（LISN）接收传导干扰信号，用 EMI 测试接收机（或高端频谱仪）进行测试。测试过程中必须用 EMI 标准的准峰值（QP）检波。
测试方法	用近场探头手动逐区域诊断，或用示波器探头逐端子测试以追踪 EMI 根源，解决一个问题后，需要再次进行诊断，如此往复，直至没有 EMI 问题	EMI 测试系统软件自动完成测试并给出测试报告

峰值检波与准峰值检波：

EMI 认证机构通常按照 EMI 标准的准峰值检波进行测试，而 EMI 诊断中往往用峰值检波，两者不匹配，EMI 诊断是否还有意义？由于 EMI 诊断的目的是为了找出 EMI 的根源，并不需要绝对的精确的测试，而是需要相对的重复性好的测试。准峰值检波用来检测信号包络加权后的峰值（准峰值），它根据时长和重复率对信号加权。准峰值检波的平均过程需耗费时间，测试时间长，不利于日常诊断。由于准峰值检波测试幅度结果永远小于或等于峰值检波的测试结果，因此在进行 EMI 诊断时，用峰值检波可以快速发现 EMI 问题。

客户痛点：

1. 从电路板设计开始就应该考虑 EMI 问题，但受资金限制，EMI 诊断设备往往不能配备到位。
2. 电子产品设计定型后去进行 EMC 认证测试，认证机构给出不合格报告，仅指出辐射还是传导 EMI 不合格，虽然给出干扰频点，但并不指出电子设备中 EMI 不合格的具体位置或原因，需自行进行 EMI 诊断，耗费时间与资金。
3. 某些设备受环境制约无法进行屏蔽，需找出 EMI 根源从设计上解决。频谱仪是发现 EMI 问题的基本测试仪器，但某些情况下难以追踪 EMI 的根源。
4. 某些 EMI 问题可以通过屏蔽方式解决，虽然可以通过 EMC 认证，但 EMI 影响该设备自身性能，必须从根源上解决，或找出问题所在加以回避。在此种情况下，频谱仪存在与 3 同样的问题。
5. 随着数据速率的加快，周期性突发的 EMI 问题日益增多，必须通过对 EMI 周期的分析找出问题的真正根源，这需要调制域分析。
6. 传导类 EMI 可以用示波器追踪，同时需要用频谱仪测试，需要两种仪器结合运用。

泰克测试方案及优势：

1. 方案：MDO4014-3 + 近场天线 + P6150 + N 转 SMA
2. 特点：
 - a) 五合一，完备的示波器功能既可以满足日常电路调测需求，还可以追踪 EMI 问题的根源；频谱仪功能可以随时诊断 EMI 问题。
 - b) 具有特色的跨域分析功能，便于分析 EMI 的真正根源
 - c) 频谱高灵敏度、分析带宽宽，适用于 EMI 诊断测试
 - d) 可测试射频幅度随时间的变化，便于分析周期性 EMI 问题产生的根源

- e) P6150 探头（选配）可直接将电路板电源或地线连接到 MDO 频谱仪射频输入端，测试电源纹波或地线不合理引起的 EMI 问题



P6150 探头



N 转 SMA



近场探头

案例一 利用 MDO 诊断风扇 EMI 超标问题

时间：2012 年 11 月 21 日

地点：上海浦西某实验室

待测试设备：某型号风扇

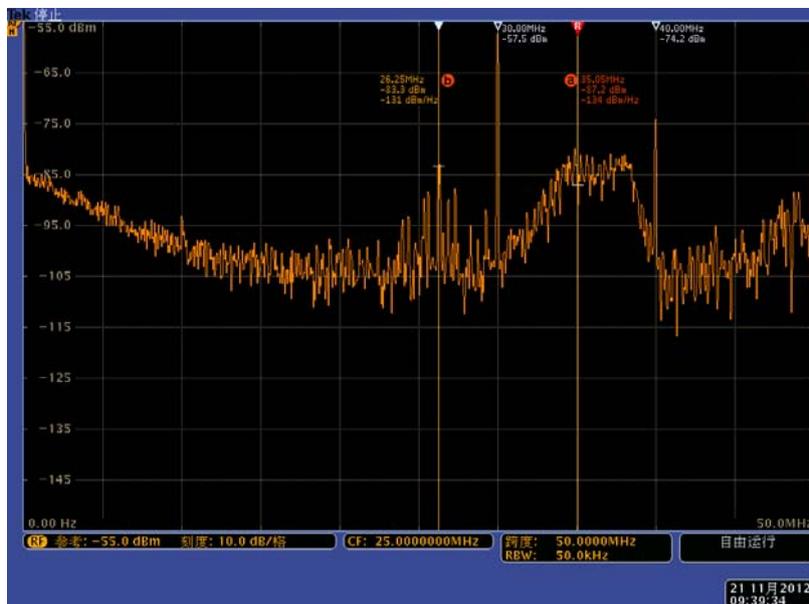
测试仪器：泰克 MDO4104-3 + 近场探头

面临的问题：

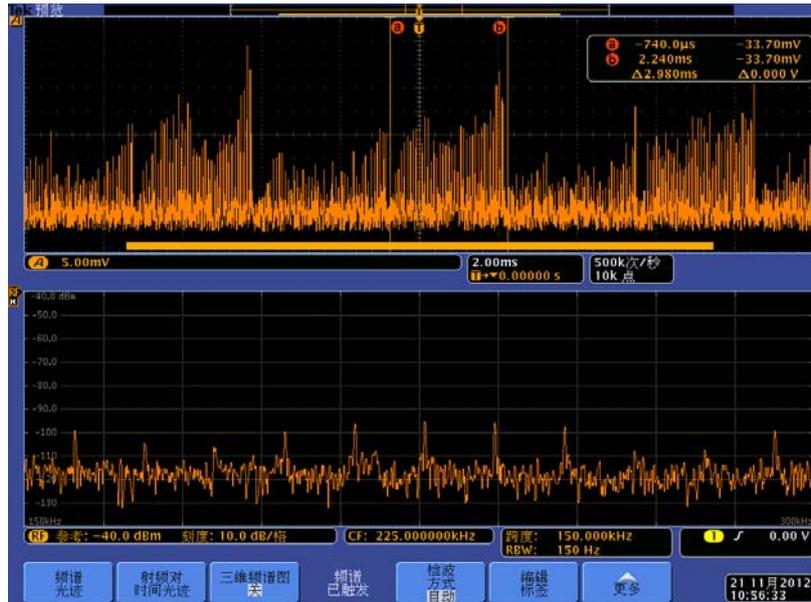
产品研发成功后，需通过 EMI 标准测试。之前已经将产品送出去测试了 3 次，每次测试的花费都在 1 万人民币，却始终没有通过。检测机构给出的报告也只告知了超差的频点，没有给出超差的原因。

实测过程：

在 MDO 上连接好近场探头后，用 MDO 频谱仪功能测试电机的射频辐射，发现在 50KHz 至 40M 频率范围内辐射很大，特别是在 20MHz 和 40MHz 附近。



经过和客户的沟通后，了解到该型号产品使用的是 PWN 调制，调制频率为 20KHz，通过改变占空比来改变转速。了解到该情况后，使用了 MDO 的时域频域联调功能，测试结果图如下



通过 MDO 的时域频域联调功能,做幅值随时间变化的曲线,可以发现辐射功率基本上以 3ms 为一个大周期。在每一个周期内,射频辐射功率逐渐增大,在周期结束时到达最大值。通过这一测试结果,我们可以确认该风扇 EMI 问题和 PWM 调制相关。因为在 3ms 周期内辐射功率的变化基本和 PWM 波的占空比变化成正比。

案例总结:

本案例除了应用了 MDO 的频谱分析功能外,还应用了 MDO 射频信号幅度随时间变化的功能,这是一种调制域分析。利用该功能, MDO 可以将 EMI 频谱以及 EMI 信号的幅度随时间的变化关联在一起,对查找类似本案例中这种周期性变化的 EMI 问题的根源很有帮助。

案例二 利用 MDO 诊断无线 POS 机 EMI 问题

时间: 2013 年 3 月 17 日

地点: 深圳某公司

待测试设备: 某正在研发阶段无线 POS 机

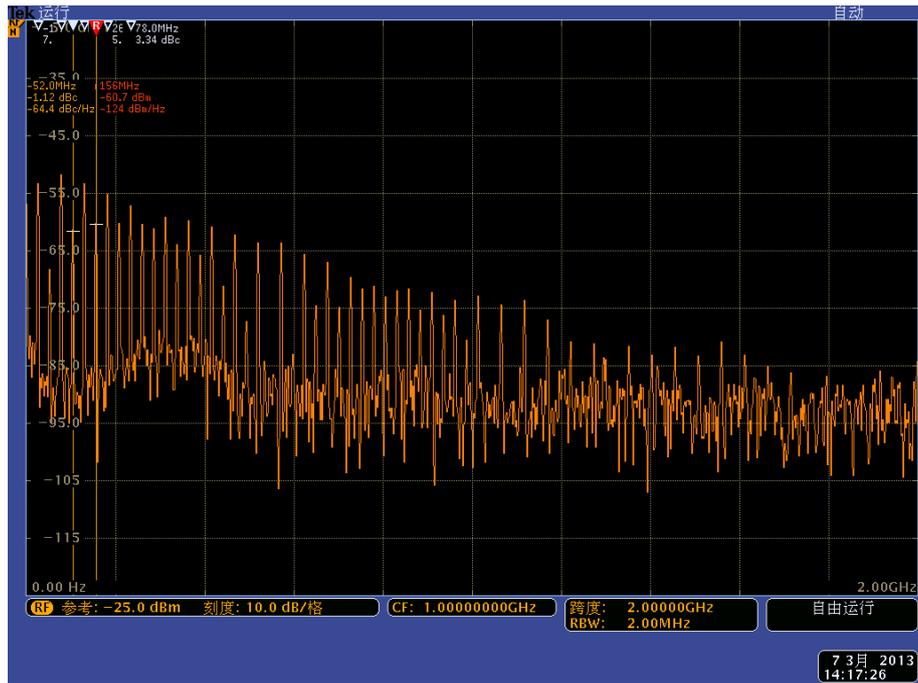
测试仪器: 泰克 MDO4104-6 + 近场探头

面临的问题:

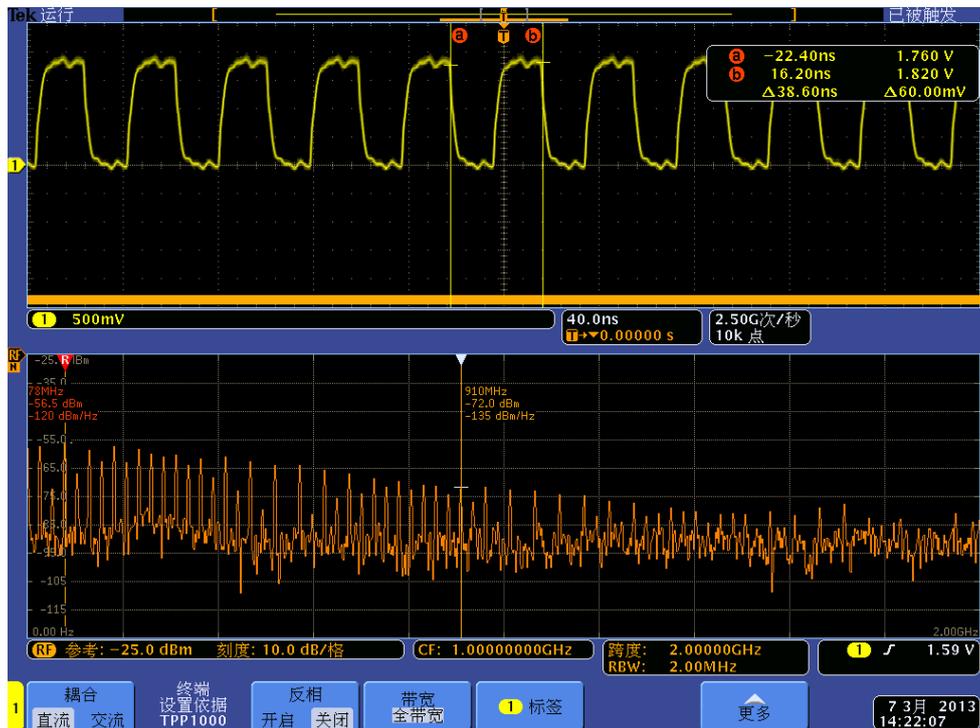
该无线 POS 机已经在该公司初步研发成型,由于该产品要利用中国移动 900M GSM 网络传输刷卡信息,除了 EMC 认证标准外,还要对移动通信性能指标进行测试。经过几次测试,发现该产品 GSM900M 接收灵敏度仅为-70dBm,远未达到-90dBm 的指标。该公司有频谱仪,用该仪器已经发现这款无线 POS 机在 900MHz 频带内存在非常严重的 EMI 问题。为此,该公司设计人员对电路板无线部分设计几经改动,但对 EMI 的降低效果并不明显。

实测过程:

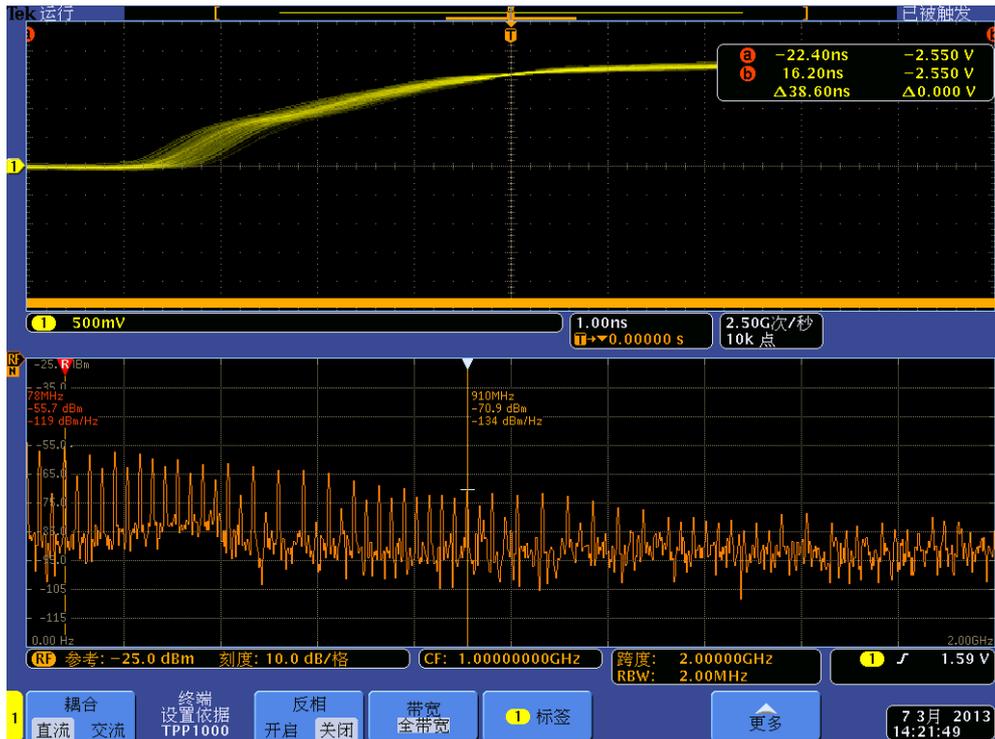
在 MDO 上连接好近场探头后,用 MDO 频谱仪功能测试该无线 POS 机电路板的射频辐射,中心频率设定为 1GHz,跨度为 2GHz,测试结果显示,该电路板 EMI 问题延续至 1.8GHz,在 100MHz 时 EMI 幅度达-60dBm,900MHz~1GHz 达-70dBm,这基本上验证了该公司用频谱仪测试的结果。由于 EMI 在 900MHz 的辐射强度大-70dBm,当中国移动 GSM900MHz 下行信号比-70dBm 低时,将被 EMI 干扰所淹没,该 POS 机将无法接收,因此其接收灵敏度只能达到-70dBm。



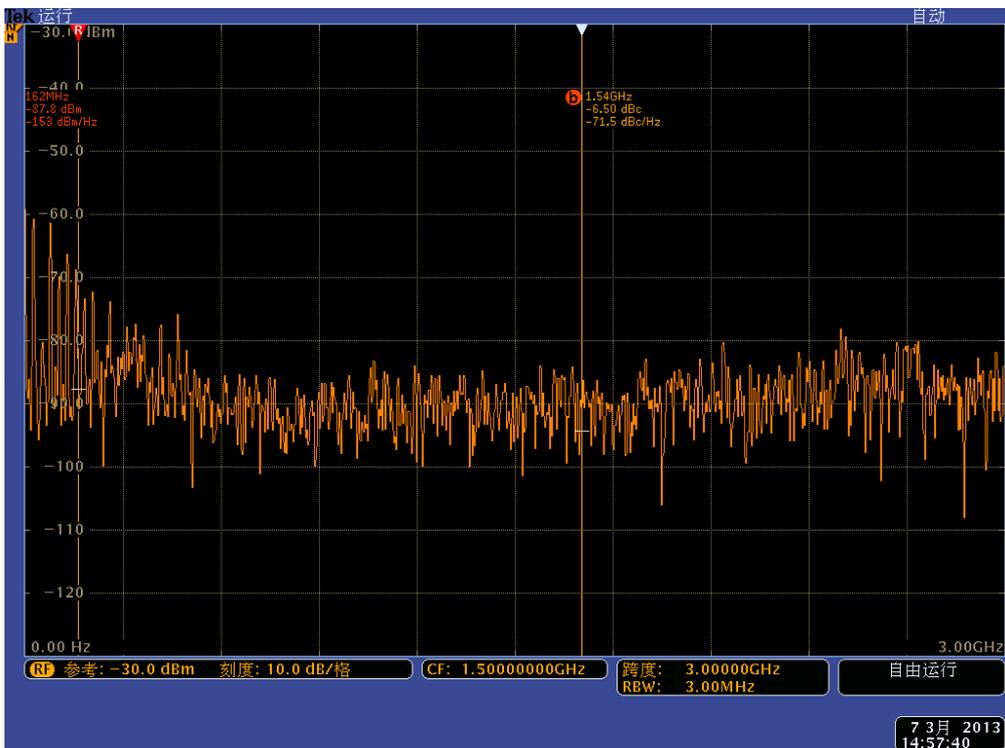
上述 EMI 频谱为典型的方波频谱，但典型的方波频谱中仅包含奇次谐波，而此 EMI 频谱中包含偶次充分。另外，方波频谱 5 次以上的谐波幅度应该很低，但此 EMI 频谱包含极高次谐波分量。为进一步探寻此 EMI 的根源，我们将 MDO 通道 1 探头连接到该无线 POS 机电路板时钟端子，得到时钟与频谱跨域显示。



通道 1 显示的时钟纹波较大，这可说明该 EMI 频谱中为什么包含偶次谐波成分，但并不能找到 EMI 频谱扩展到 900MHz 的根源。为此，我们将 MDO 时基调小，得到通道 1 时钟信号展开后的波形与 EMI 频谱的对应图，我们发现该时钟信号的抖动非常严重，这就是造成该 EMI 频谱扩展到 900MHz 的原因。



与该公司设计人员讨论后，得知该电路板时钟信号是由晶振经一个分频电路整形后产生的，以前他们也曾怀疑时钟问题，但用示波器测试晶振输出，波形相当理想，便未怀疑时钟问题。为此，设计人员断开分频整形部分，将晶振输出的时钟信号直接飞线为电路板的时钟，再测试该电路板 EMI 频谱如下：



由此频谱图可见，该时钟的高次谐波没有超过 200MHz，900MHz 时的已经没有 EMI 问题，可确认该无线 POS 机 EMI 问题由电路板上的时钟分频与整形电路引起。由于该无线 POS 机的工作时钟必须是分频后的时钟，找到 EMI 根源后，设计人员需重新设计分频及整形电路。

案例总结：

本案例除了应用了 MDO 的频谱分析功能外，还应用了 MDO 示波器与频谱跨域显示功能，利用此功能，轻松地找到了 EMI 的问题所在。

案例三 利用 MDO 测试开关电源引起的 EMI 问题

时间：2012 年 11 月 16 日

地点：华北电力大学

待测试设备：某电子设备电路板

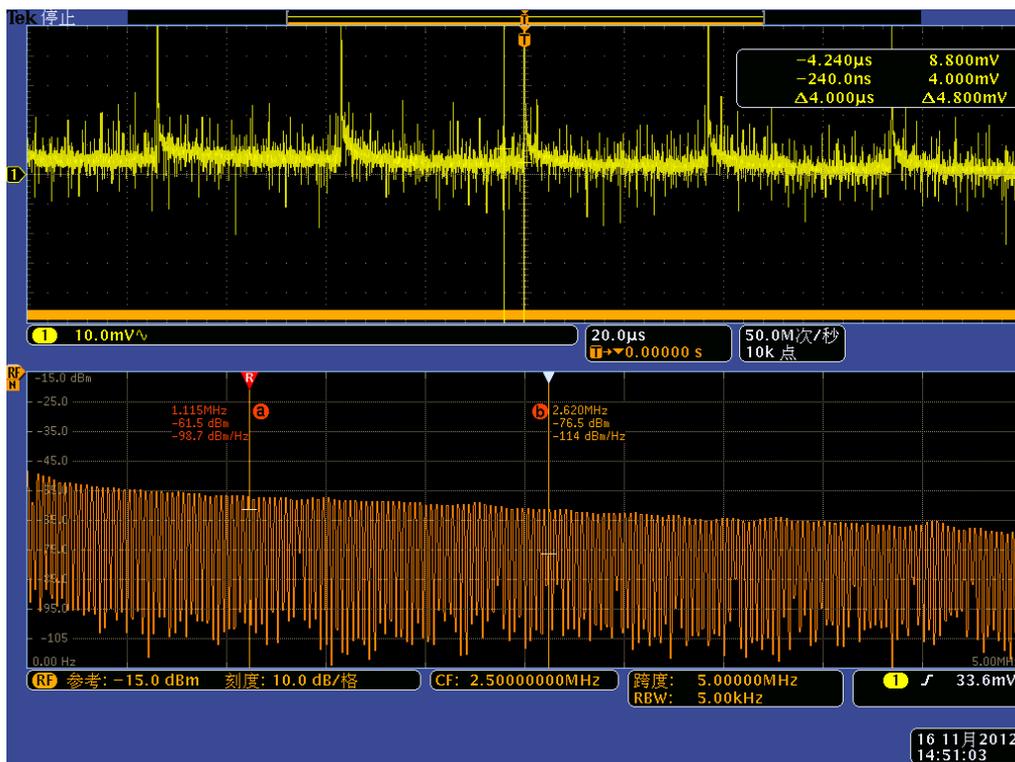
测试仪器：泰克 MDO4104-6 + BNC 电缆

面临的问题：

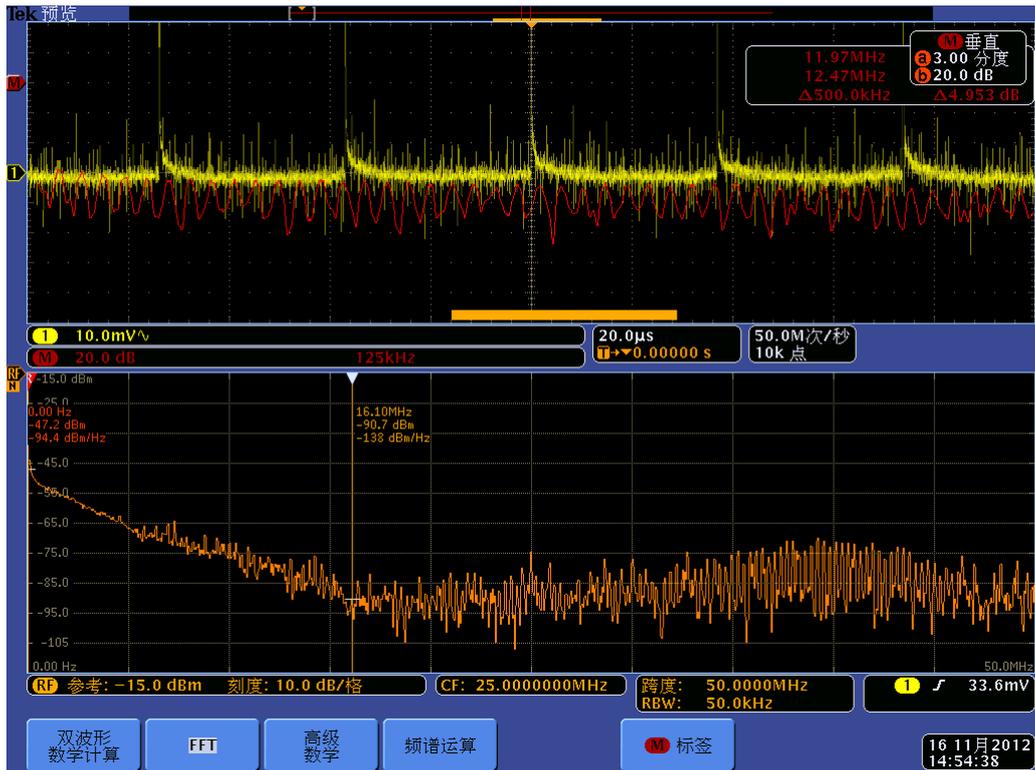
该电子设备电路板为直径 15 厘米的圆形，放置于金属屏蔽壳内，EMC 认证没有问题，但该设备自身工作并不正常，怀疑是开关电源纹波造成的影响。由于开关电源纹波的频率通常很低，传统的测试方法是用示波器监测电源波形，并对该波形进行 FFT 运算以显示电源纹波的频谱。由于示波器 FFT 所运算的频谱，其跨度受制于示波器的时基，而且动态范围远低于频谱仪，因此测试效果并不理想，没有确认电源纹波问题。由于 MDO 是示波器与频谱仪的结合，客户便决定拿 MDO 再次测试。

实测过程：

首先测试该电路板+5V 电源纹波，MDO 示波器通道 1 直接连接在+5V，用交流耦合测试纹波。为了对比，用 BNC 电缆一端连接 MDO50 欧姆射频输入端，另一端剥开外皮直接连接到+5V 上，设置中心频率为 2.5MHz，跨度为 5MHz。测试结果如下图：



由测试结果可知，该电源纹波达 20mV 左右，其频谱在低频段达-50dBm 左右。为了看清电源纹波的影响，我们在示波器端做 FFT，同时将频谱仪的跨度设定为 50MHz，测试结果如下：



从测试结果可知，示波器功能的 FFT 所显示的频谱与频谱仪 5MHz 跨度频谱类似，但并不能看出什么问题，而此图中的频谱显示，该+5V 电源纹波的占用带宽一直延续到 16MHz，因此对该设备影响严重。由此找到该设备工作不正常的真正原因。

案例总结：

本案在测试电源纹波时，用示波器的同时，也应用了频谱仪。灵活设置频谱仪的跨度，可轻松测试电源纹波在频域中的占用带宽，MDO 集示波器和频谱仪功能于一身，可将时域与频域联合显示，非常适于此类应用。

案例四 利用 MDO 地线布局不合理引起的 EMI 问题

时间：2012 年 11 月 16 日

地点：华北电力大学

待测试设备：某电子设备电路板（与案例三为同一个设备）

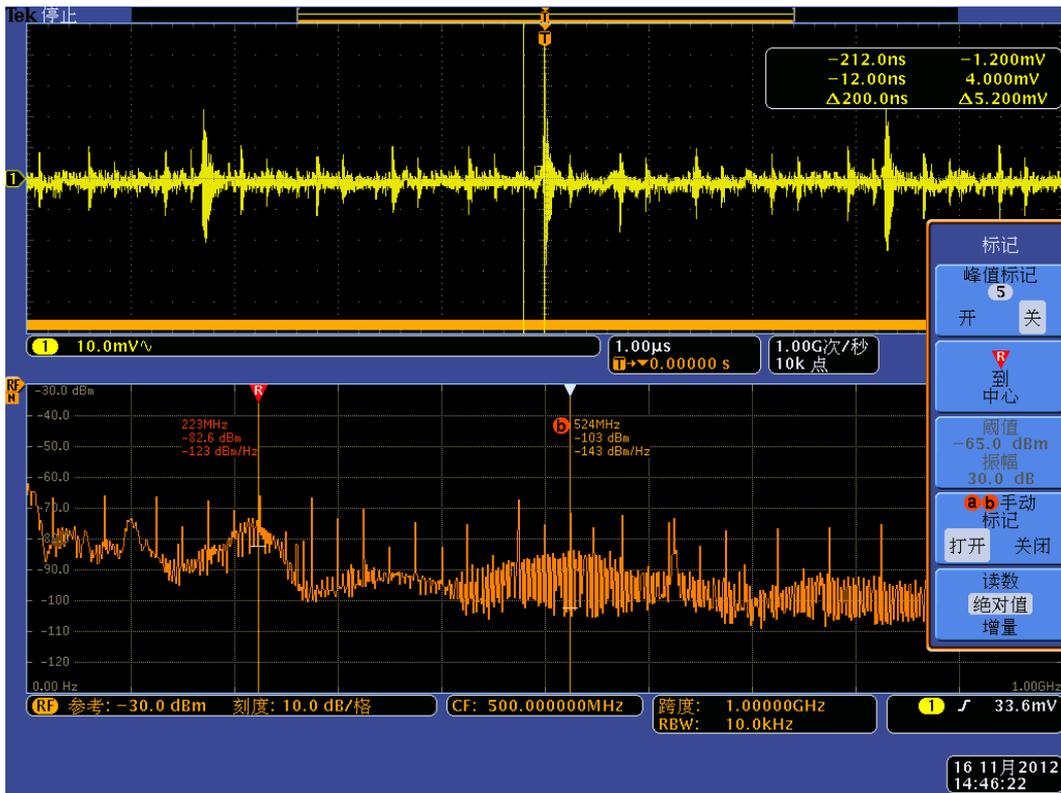
测试仪器：泰克 MDO4104-6 + BNC 电缆

面临的问题：

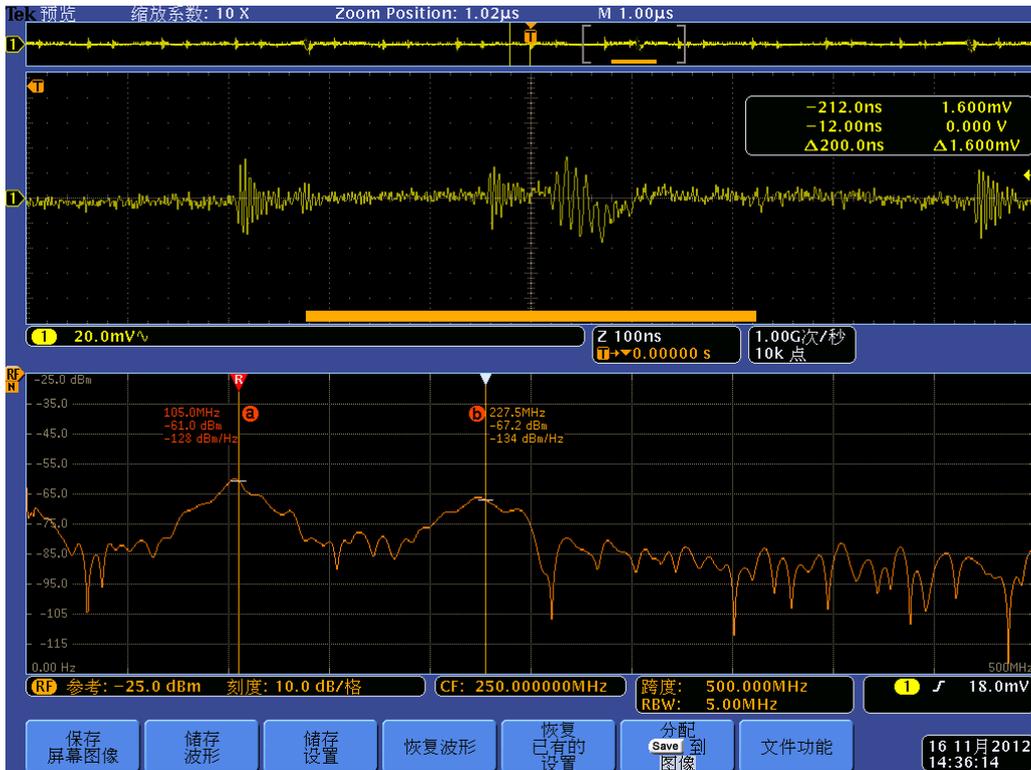
在找到案例三中的问题后，我们立刻想到，既然电源纹波会影响设备性能，地线上是否也会由于布线不合理而存在该开关电源纹波造成的 EMI 问题？为此我们做进一步测试。

实测过程：

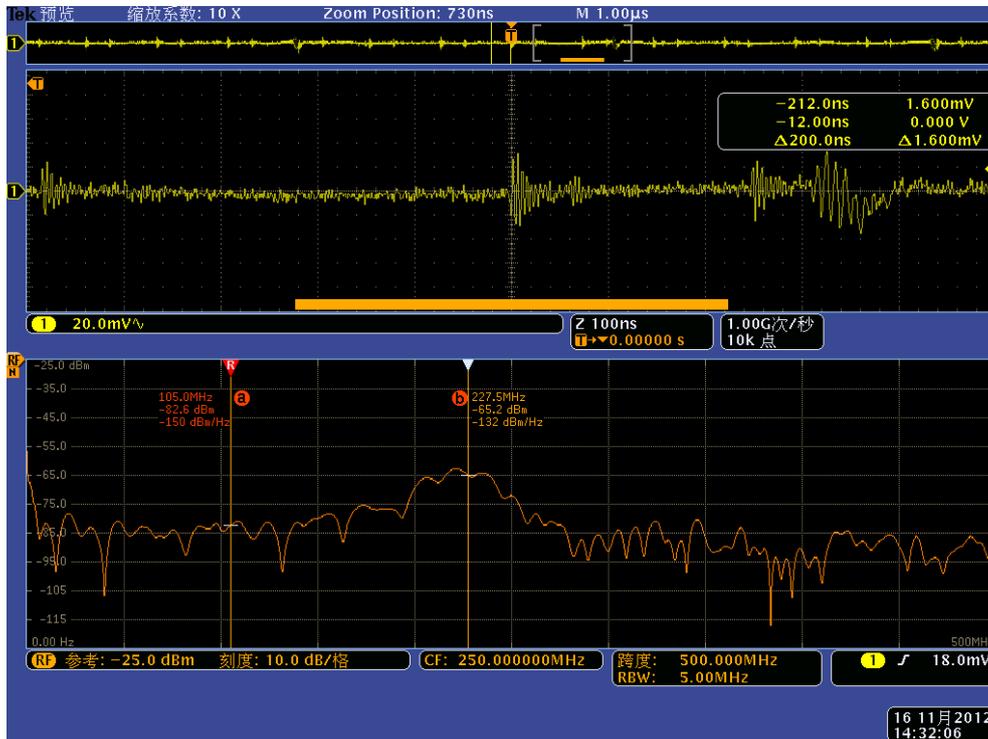
将示波器探头接到该电路板地线，同时将 BNC 电缆也接到地线，为观测地线的 EMI，我们测试 1GHz 跨度的频谱，测试波形如下：



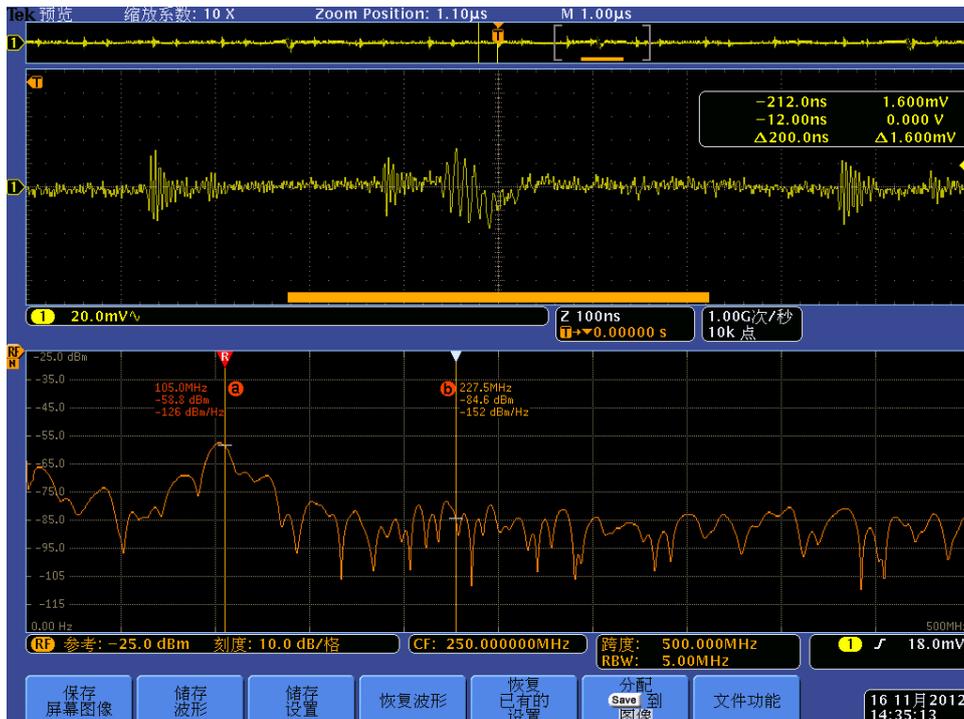
由此图示波器波形可知，该电路板地线上很不干净，最大纹波月 20mV。在上图下半部分的频谱图中，发现较严重的 EMI 问题，几乎在这个 1GHz 跨度内都存在。从频谱曲线的形状可以判断，该地线上既存在开关电源造成的 EMI 同时也存在时钟泄露造成的 EMI 问题，因为在频谱曲线上有类似方波的谐波成分。通过测试谐波分量的频谱间隔，可以轻松测试该时钟泄露频率为 25MHz。由与 EMI 问题遍布整个跨度，为了测试 EMI 最严重的频段，我们将 MDO 频谱仪跨度降低为 500MHz，RBW 设置为 5M，得到如下测试结果：



由测试结果可知，该地线在 105MHz 和 227.5MHz 两处 EMI 幅度较高，利用 MDO 跨域分析功能，在上半部分时域曲线中，橙色条位置为下半部分频谱分析时间段，此时该时间段位于距触发点 1.02uS 处，即地线上较宽的波形处。我们向左调整频谱分析时间段，得到如下测试结果：



此时，频谱分析时间段位于距触发点 730ns 处，即地线上较短的波形处，可知该处产生 227.5MHz 的 EMI 干扰。再调整频谱分析时间段至地线杂波较宽处，即距触发点 1.1uS 处，得到测试结果如下：



由测试结果可知，此处地线上的纹波产生 105MHz 处的 EMI。通过以上跨域分析，我们可以

找到 EMI 产生的根本原因。

案例总结:

本案在测试地线上的纹波时，在用示波器的同时，也应用了频谱仪，可以轻松发现 EMI 问题。灵活设置频谱仪 RBW，利用 MDO 独有的跨域分析功能，可轻松查找某个频段的 EMI 产生的根源。

案例五 利用 MDO 测试高速数据引起的 EMI 问题

时间：2012 年 11 月 16 日

地点：华北电力大学

待测试设备：某视频信号处理设备电路板

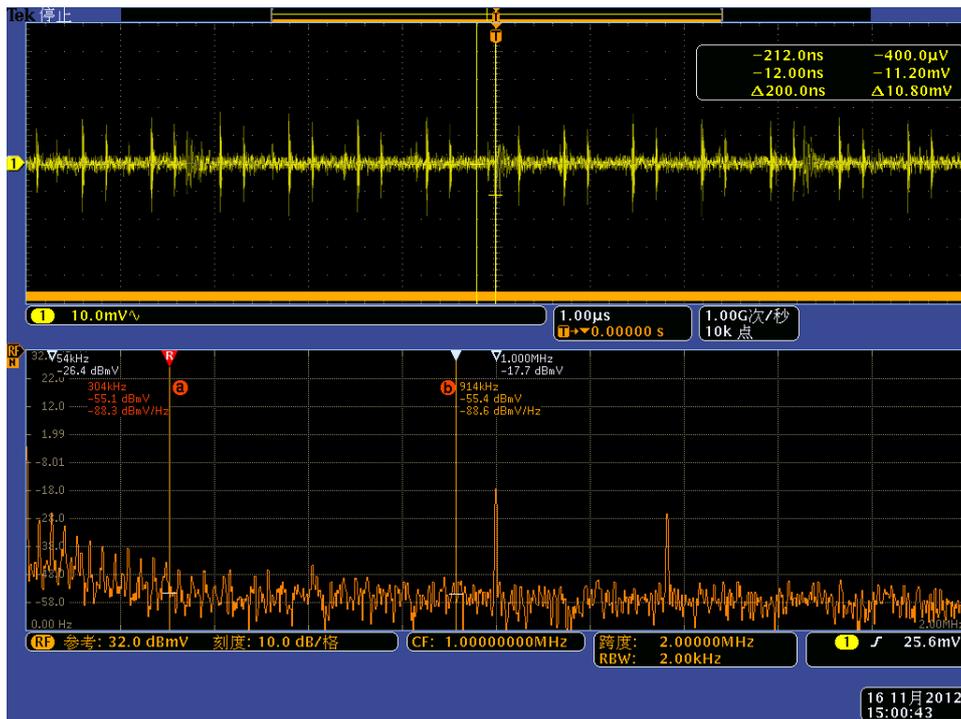
测试仪器：泰克 MDO4104-6 + BNC 电缆

面临的问题:

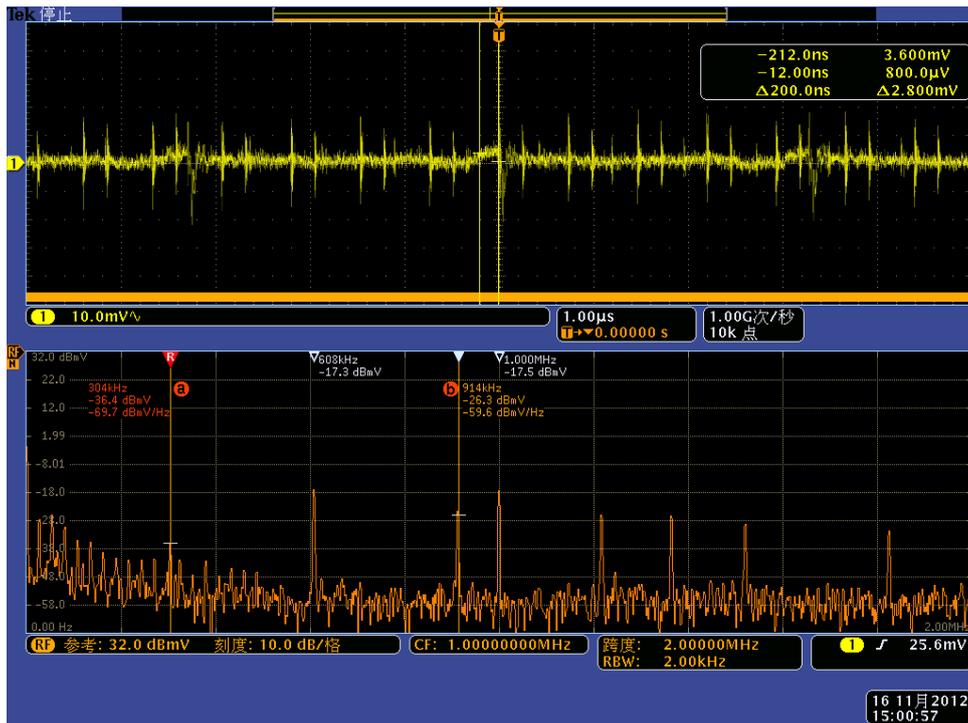
本案例中的客户与案例三和案例四是同一客户，但被测电路板不同，本次测试该客户另一款视频信号处理单元的电路板。众所周知，视频信号对于干扰十分敏感，处理不好，很容易出现马赛克现象，该客户就存在这样的问题

实测过程:

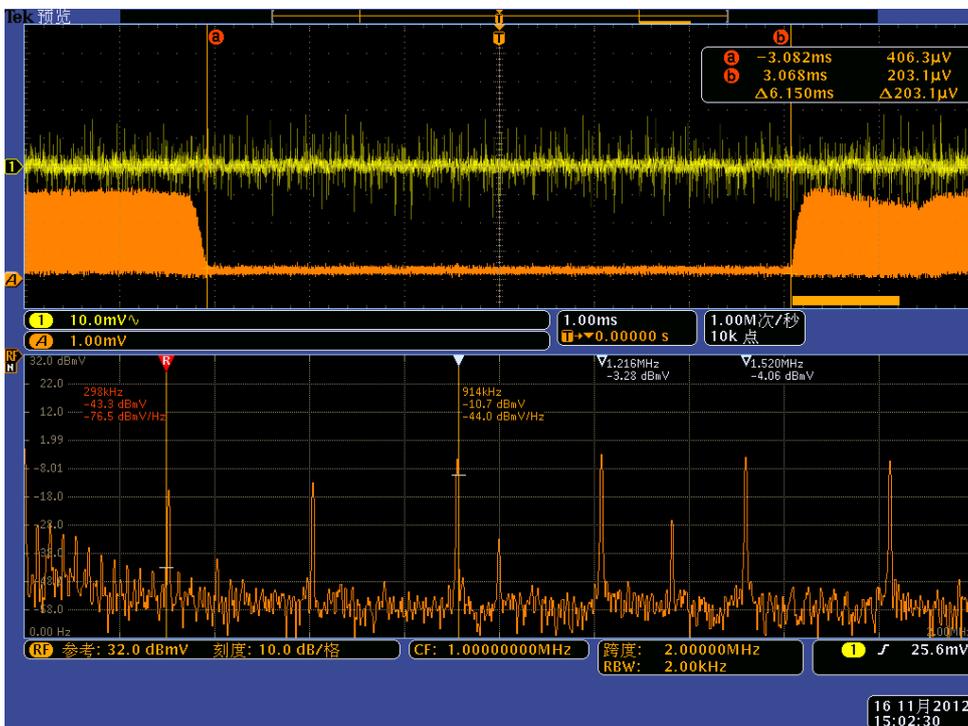
由于有了前两次的测试经验，我们直接想到的就是电源或地线上的 EMI 问题，于是将示波器通道 1 接到该电路板+5V 供电，同时用 BNC 电缆将该电源接到频谱仪输入端，得到测试结果如下：



在这个测试结果中，我们发现黄色的电源波形上仍然有 20mV 的纹波存在，下半部分的频谱图中，低频端的底噪抬起以及相应的频峰也是典型的电源纹波造成的 EMI 频谱。光标 a 示意出该电源纹波的 EMI 带宽只有 384kHz，远低于案例三中的 16MHz，说明这个视频处理电路的供电纹波大大优于案例三中的电路，因此对视频信号造成的干扰来源，应该不是电源纹波造成的。但是从上图下半部分频谱上，我们还在 1MHz 和 1.35MHz 两个频点看到频峰，而且这些频峰还在随时间变化，另一时刻的测试结果如下：

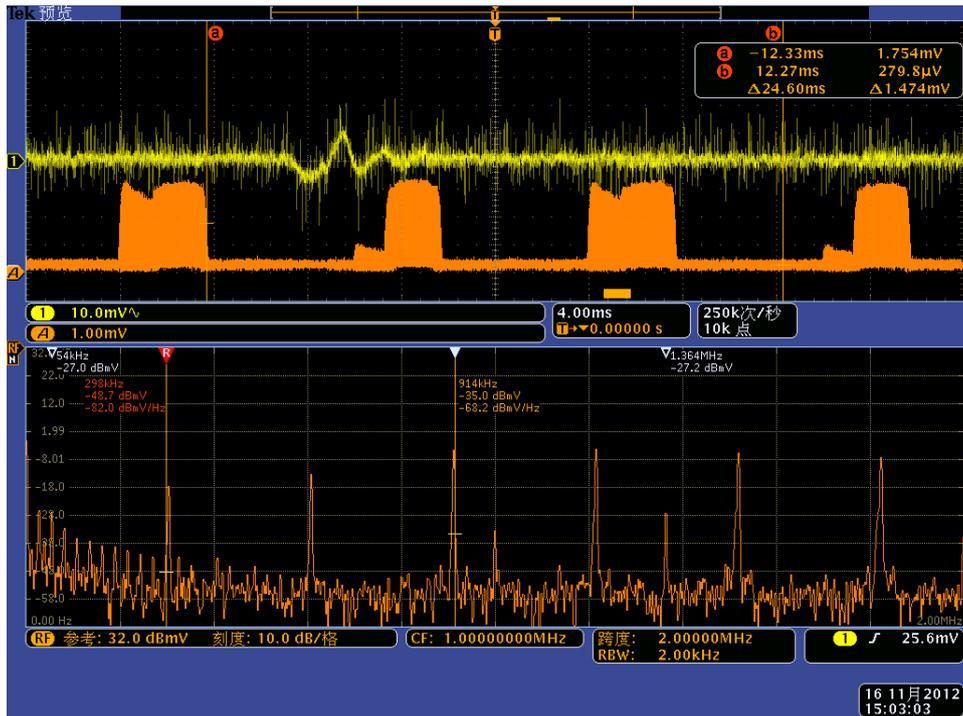


此时刻 EMI 频率峰，除了上图的两个外，还有 608KHz 以及 910KHz 等多个频率峰，这些频率峰的存在，预示着该 EMI 问题可能与某些时钟串扰有关，由于其呈周期性变化，一时还难以判断与哪类时钟有关。对于这种呈周期性变化的 EMI 问题，最好的测试方法就是对射频信号进行幅度解调，将射频信号的幅度随时间的变化规律显示出来。为此我们将 MDO 时域的时基由 10µs 调整为 10ms，同时打开 MDO 射频幅度随时间变化的功能，得到下面测试结果：

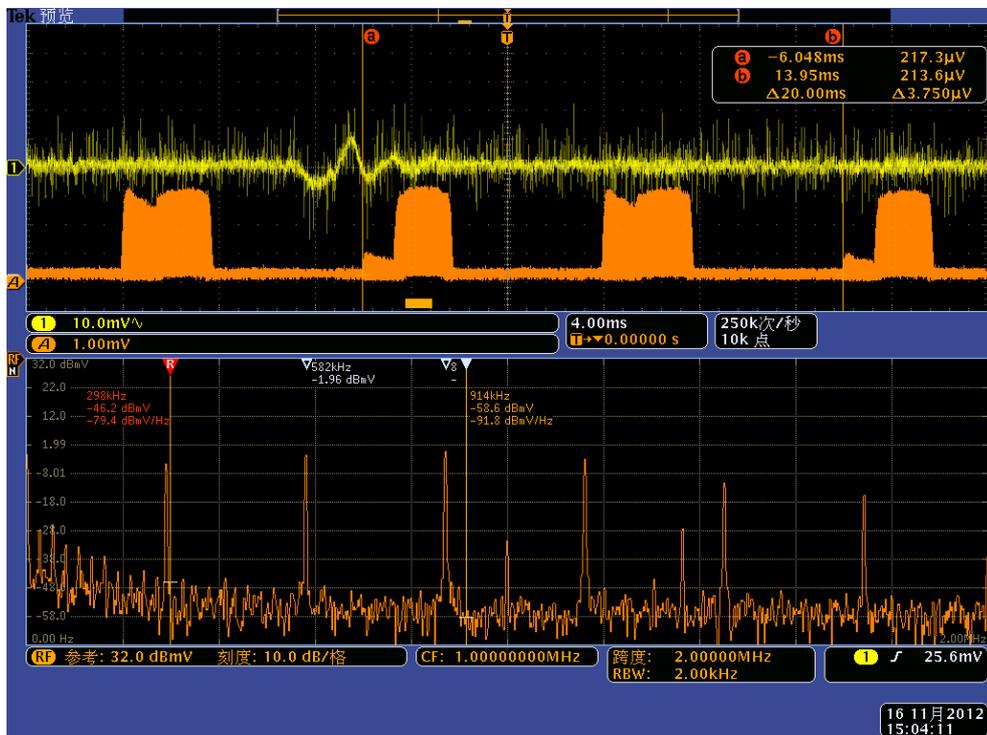


通过上图中上半部分时域波形中橙色的幅度随时间的变化曲线，我们已经发现了射频信号的幅度呈规律性的变化，只是 10ms 时基仍然不够长，无法看清射频信号变化的全貌，于是我

们进一步将时基延长到 40mS，得到测试结果如下图：

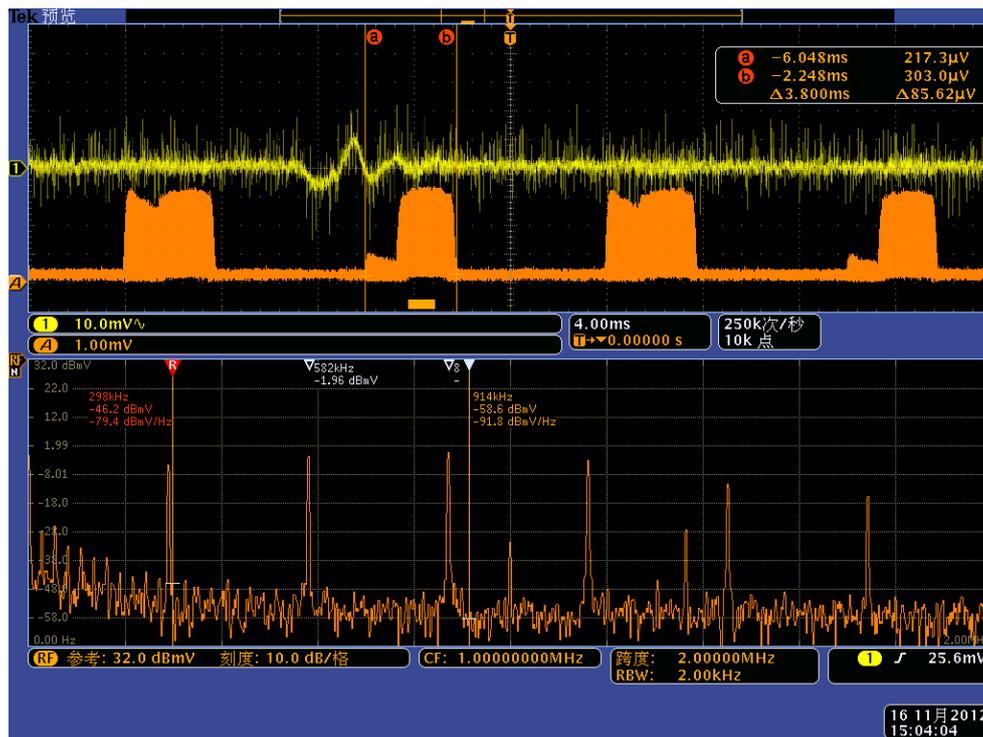


由此图上半部分时域波形中的橙色曲线，我们可以看到明显地发现射频输入的幅度呈周期性变化的规律。在此图中，表示频谱时间段的橙色条位于较宽的突发处，下半部分频谱图显示频率峰间隔约 300KHz，说明此刻 EMI 与一个 100KHz 时钟有关。我们将频谱分析时间段移动到带有台阶的突发较窄段，得到如下结果：



此时的频峰间隔比 300KHz 短，说明此时刻 EMI 与另一个频率低于 100KHz 的时钟有关。我们在时域波形中打开光标，可以此时带台阶的突发重复周期约 20mS，较窄突发与较宽突发重复周期约 10mS，由此可初步判断该视频处理单元电源线上的 EMI 与控制图像的两个时钟

信号有关。于是我们继续移动频谱分析时间段到矮台阶处，得到如下结果：



此时，频峰间隔再起变化，由此找到另一个干扰视频质量的时钟泄露问题。

案例总结：

对周期性变化的 EMI 干扰问题，MDO 的幅度随时间变化功能非常有用，可以轻松找到潜在的多个问题的根源。

案例六 利用 MDO 测试高速数据引起的 EMI 问题

时间：2011 年 11 月 17 日

地点：西安某公司

待测试设备：某电子设备电路板

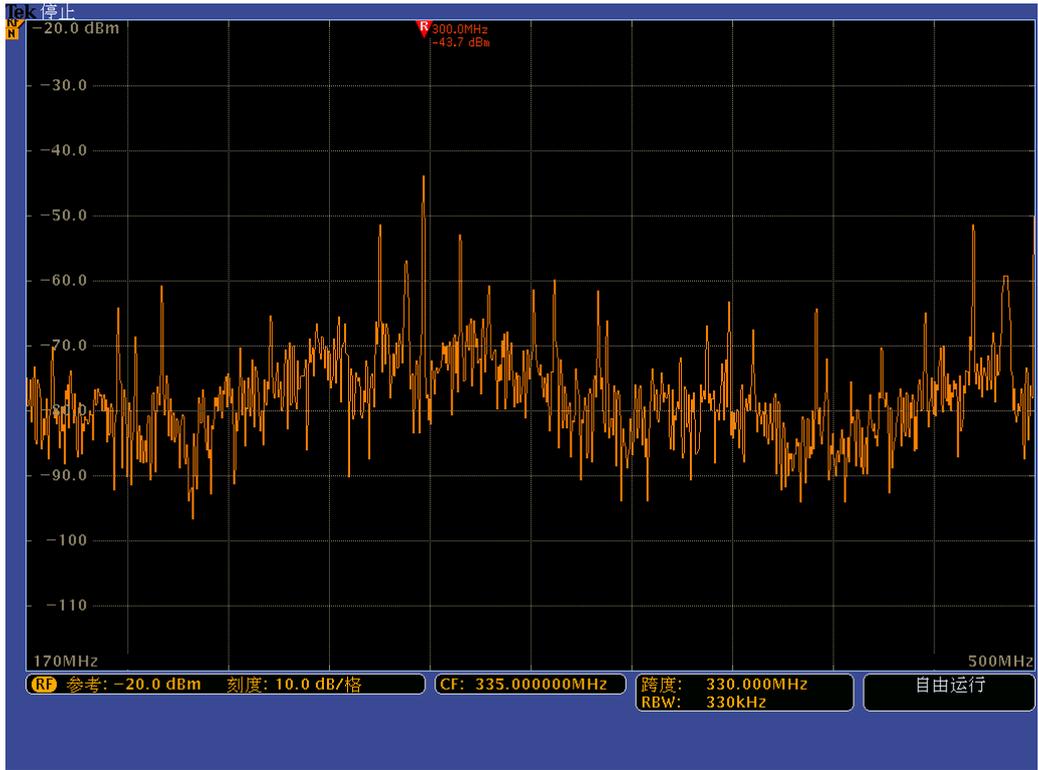
测试仪器：泰克 MDO4104-6 + 近场探头

面临的问题：

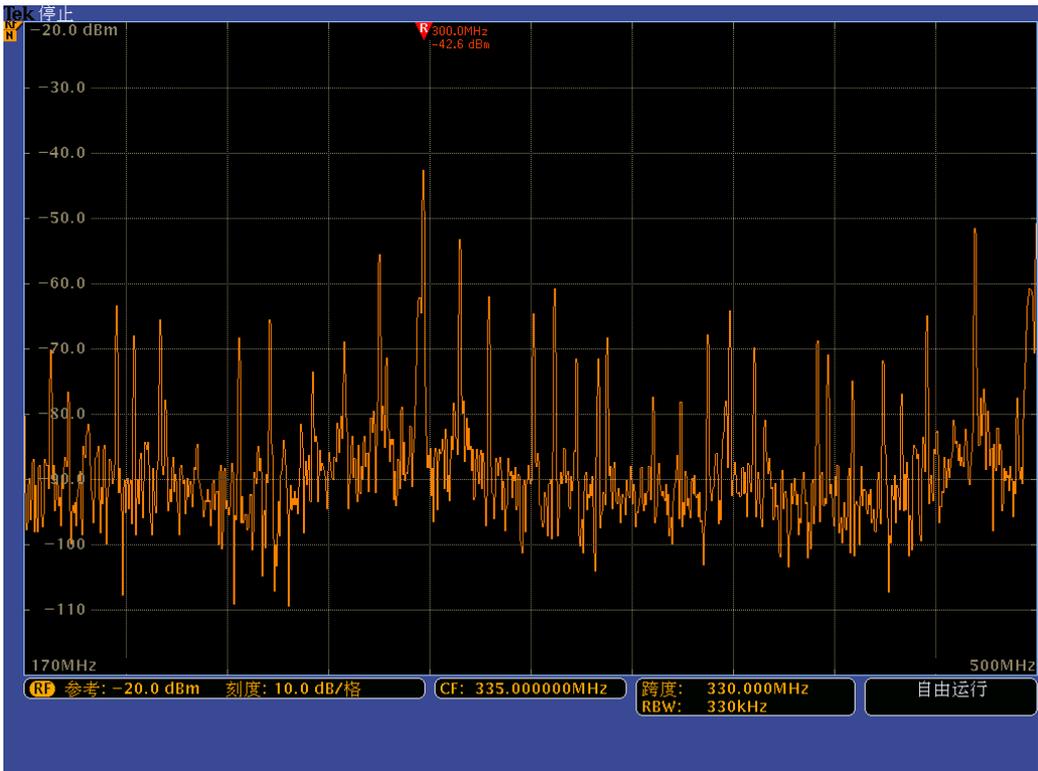
该电子设备为 300MHz 频段专用的无线通信设备，EMC 认证没有问题，但该设备自身工作并不正常，以前曾用频谱仪配近场探头测试过，发现在嵌入式射频发射电路板内 FPGA 处有较强的 EMI 辐射，造成底噪升高，使得该通信设备发射信号信噪比降低，影响通信质量。多次整改设计方案，效果不明显。

实测过程：

既然客户已经测试过 EMI，我们首先用 MDO 进行验证，在 0~330MHz 跨度内测试该电路板 EMI 问题，果然发现底噪抬升明显，EMI 问题十分严重。用近场探头逐点探测，的确在该电路板 FPGA 处底噪抬升最为明显，说明该电路 EMI 源自此 FPGA。此 FPGA 面积不大，很容易屏蔽，因此通过 EMC 认证没有问题，关键是此电路板射频输出信噪比差自身特性受影响。由于 FPGA 是此电路板的“心脏”，一旦定型，很难改动，如果重新设计，等于是从头再来，不可接受。观察一段时间，我们发现该底噪抬升是随时间变化的，于是我们分别存储了底噪最高时和底噪最低时的两个结果如下：

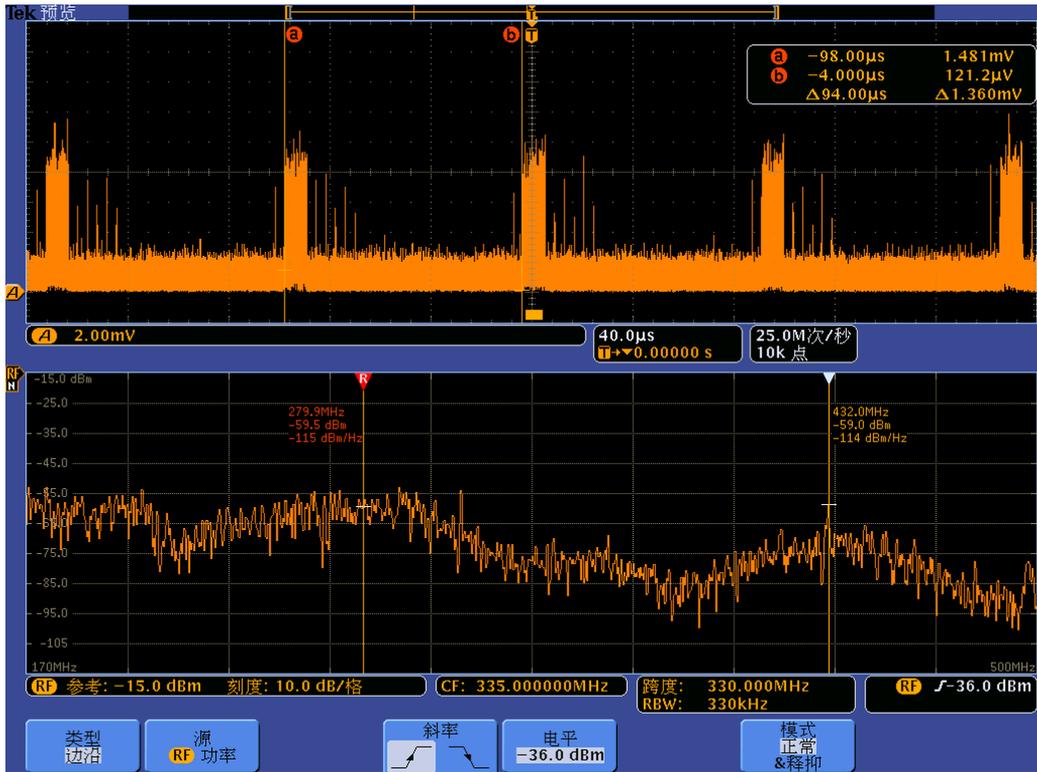


此时为底噪较高时，达-65dBm。



此时为底噪较低时，最高底噪幅度不超过-80dBm。

对于幅度随时间变化的频谱，MDO 的优势在于调制域分析，为此我们打开 MDO 幅度随时间变化曲线显示功能，用 MDO 射频功率触发得到如下测试结果：



从测试结果看，触发点处底噪幅度最高，在 280MHz 以及 432MHz 处达-59dBm。图中上半部分显示，突发幅度呈周期性变化，用 MDO 时域光标，可以测试出其周期为 94uS。我们移动代表频谱分析时间段的橙色条到突发幅度右侧的几条线处，得到测试结果如下：

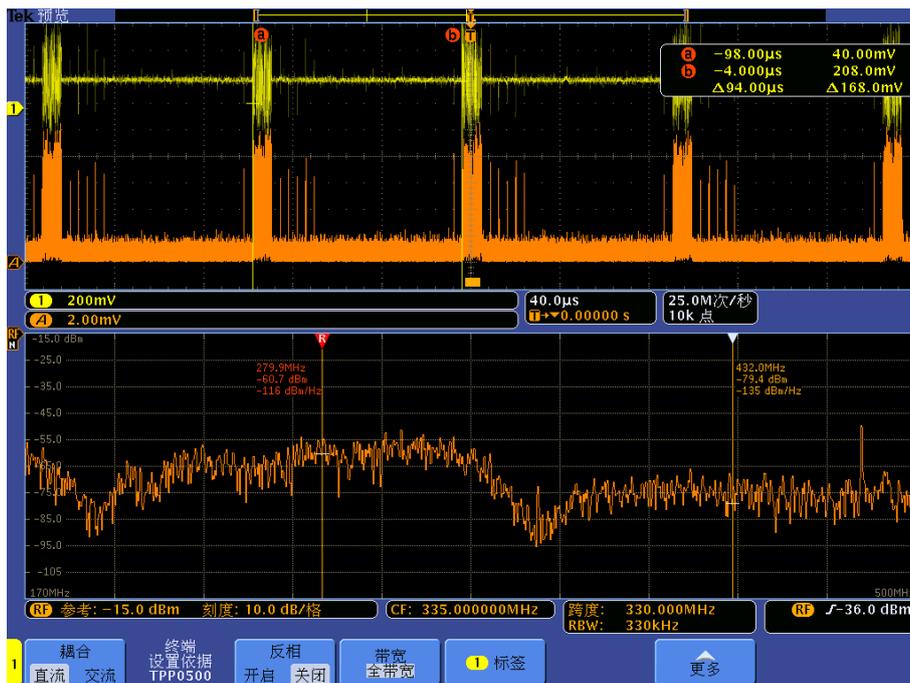


此时底噪明显下降，280MHz 处为-71dBm，当我们再将频谱分析时间段右移至完全没有突发幅度处时，得到如下测试结果：



此时底噪已经降低到-85dBm 一下，原来 280MHz 频点处被底噪淹没的-73dBm 的信号此时已经显现出来。

由于该电路板 EMI 呈周期性变化，既然 FPGA 的设计难以在短时间内更改，我们能否通过有效的控制手段，让有用的射频信号在突发周期间隔中底噪较低的时刻发射，而在突发幅度时刻不发射有用信息？客户认为此方法可行。底噪呈周期性变化，必定与电路板中某种控制信号相关，虽然我们已经测试出突发底噪变化的周期，但如果我们不知道这种周期与哪种控制信号相关，上述设想就难以实现。客户对其内部控制时序相当熟悉，94uS 的周期刚好是该电路板高速 USB 信号传输控制周期。为了验证这一假设，我们将 MDO 示波器通道 1 接到高速 USB 控制测试点，同时测试射频频谱，得到如下结果：



以上测试结果充分证明了通道 1 中的高速 USB 信号与底噪突发抬升的规律相同，证明二者相关。高速 USB 的时序由嵌入式程序控制，因此只要在程序中控制射频在高速 USB 信号发出后延迟 50uS 发射，发射持续时间小于 40uS 即可。

案例总结：

本案例利用 MDO 跨域分析及调制域分析功能，成功地确认 EMI 与高速 USB 信号相关，通过时序控制，跨域有效避免以前难以解决的问题。

案例七 利用泰克实时频谱仪发现瞬态 EMI 问题，用 MDO 追踪该 EMI 根源

时间：2013 年 4 月 1 日

地点：某公司机房

待测试设备：某电子装置

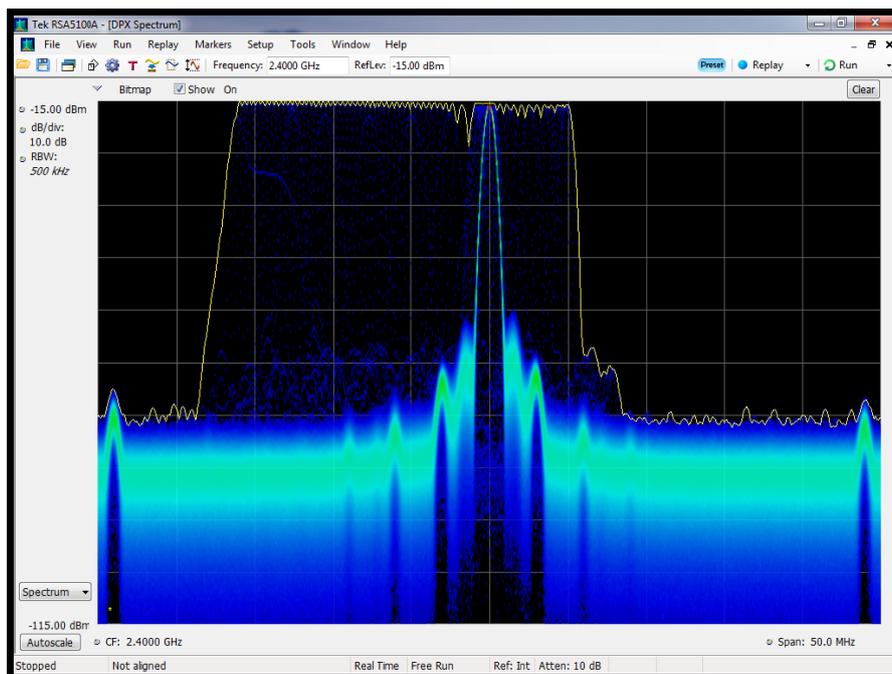
测试仪器：泰克 RSA5106，MDO4104-6 + BNC 电缆

面临的问题：

该电子装置为 2.4GHz FSK 射频发射装置，FSK 速率约 10KHz。该装置安装在某大型设备内部，定期将设备的工作参数传送到中央控制机房。该装置一般情况下工作正常，但如果操作人员对大型设备进行控制面板的操作，该发射装置传送回的数据有问题，使得大型设备存在安全隐患。检修时用误码仪测试，发现操作人员每次按大型设备控制面板按键，该电子装置发射的 FSK 信号误码将剧增。更换大型设备控制面板及相关连接线，情况依旧。用频谱仪监测操作大型设备控制面板时的 FSK 频谱，并未发现问题。

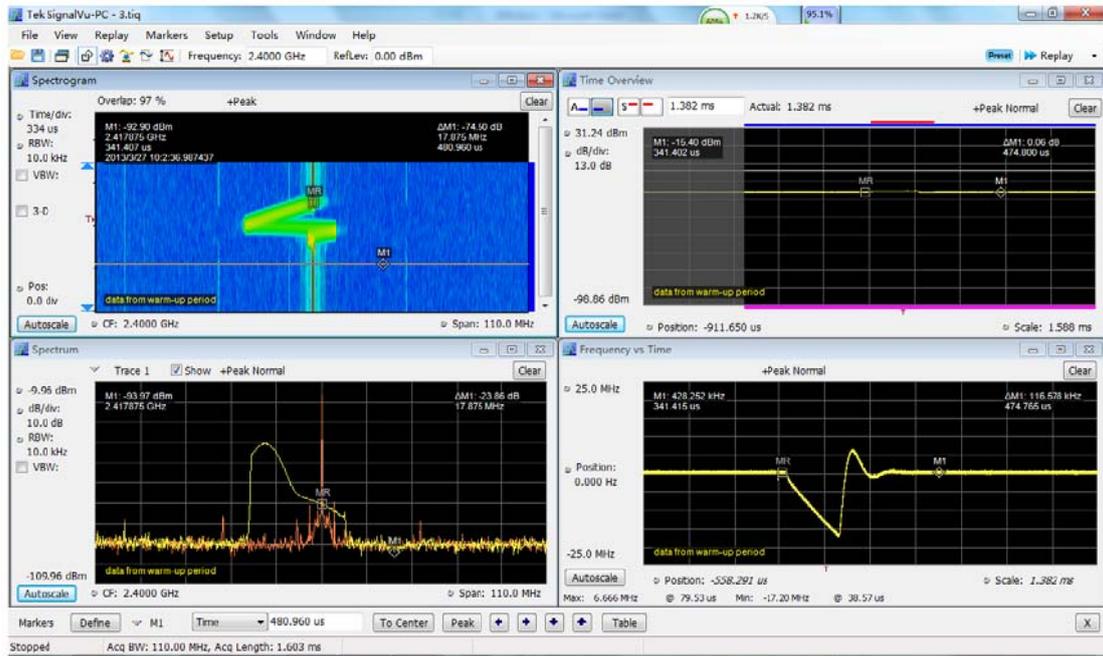
实测过程

我们首先拿 MDO 到客户现场，依然用频谱功能监测操作大型设备面板时的频谱，也没有发现问题。我们分析可能是存在问题为瞬态问题，第二天特地带来痛苦公司的实时频谱仪 RSA5106。由于 FSK 频谱可能对发现问题造成影响，我们建议客户让该电子装置仅发射 2.4GHz 载波，操作大型设备面板，用 RSA5106 DPX 功能去查找问题。由于 RSA DPX 功能可以 100% 发现频域上驻留时间大于 3.8uS 的偶发事件，在按压大型设备控制按键时，观测到如下 DPX 频谱：

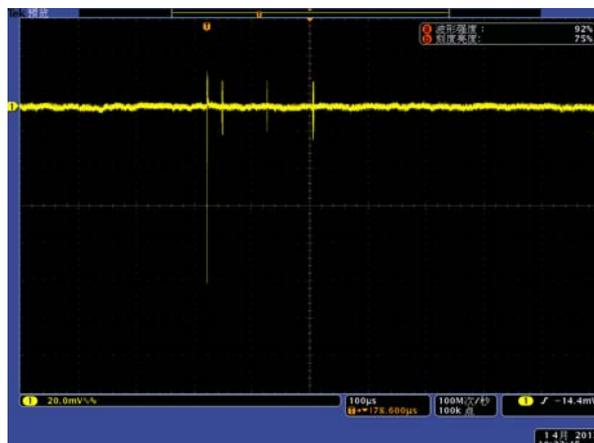


在 DPX 频谱中，颜色越蓝，表示信号驻留时间较长，2.4GHz 载波和底噪颜色较深，而那些

暗淡的蓝色表示在操作大型设备控制面板时，FSK 发射装置频率发生了改变，只不过这个改变持续时间很短。利用 RSA5106 的频域触发功能，我们轻松将这一过程捕捉下来，然后进行时间相关的多域分析，其结果如下：

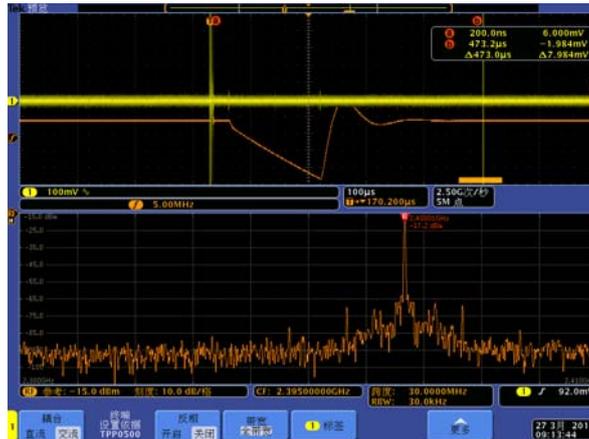


在这一结果中，左上角显示了 FSK 发射装置 2.4GHz 载波在这一变化过程中的三围频谱，右上角显示这一变化过程中的 2.4GHz 载波的幅度随时间的变化，左下角为 2.4GHz 载波的频谱，右下角为 2.4GHz 载波频率随时间的变化。由此测试结果可知，该 2.4GHz 载波在操作大型设备控制面板时，幅度基本不变，但频率有瞬态畸变，最大变化约-16MHz，变化持续时间约 470uS。由于大型设备控制面板按键为人工手动，其重复时间约秒的量级，也就是说，在 1 秒的重复周期内，2.4GHz 载波的频率在 420uS 瞬态内变化了 16MHz，这种情况，普通频谱仪很难监测到，这就是以前未能找到问题的原因。由于该 FSK 发射装置调制速率约 10KHz，即周期约 100uS，420uS 频率的变化足以引起误码。虽然找到了问题，但如何解决此问题？误码必须找到引起该问题的根源。误码分析一下引起该问题的前因后果：操作人员按了大型设备的按键引起监控发射装置的性能变化。一般情况下，按键所能造成的干扰，不是在地线上，就是在电源上。于是我们将 MDO4104-6 的示波器通道 1 连接到 FSK 的供电电源上，按压大型设备控制按键，果然在波形上监测到干扰毛刺：

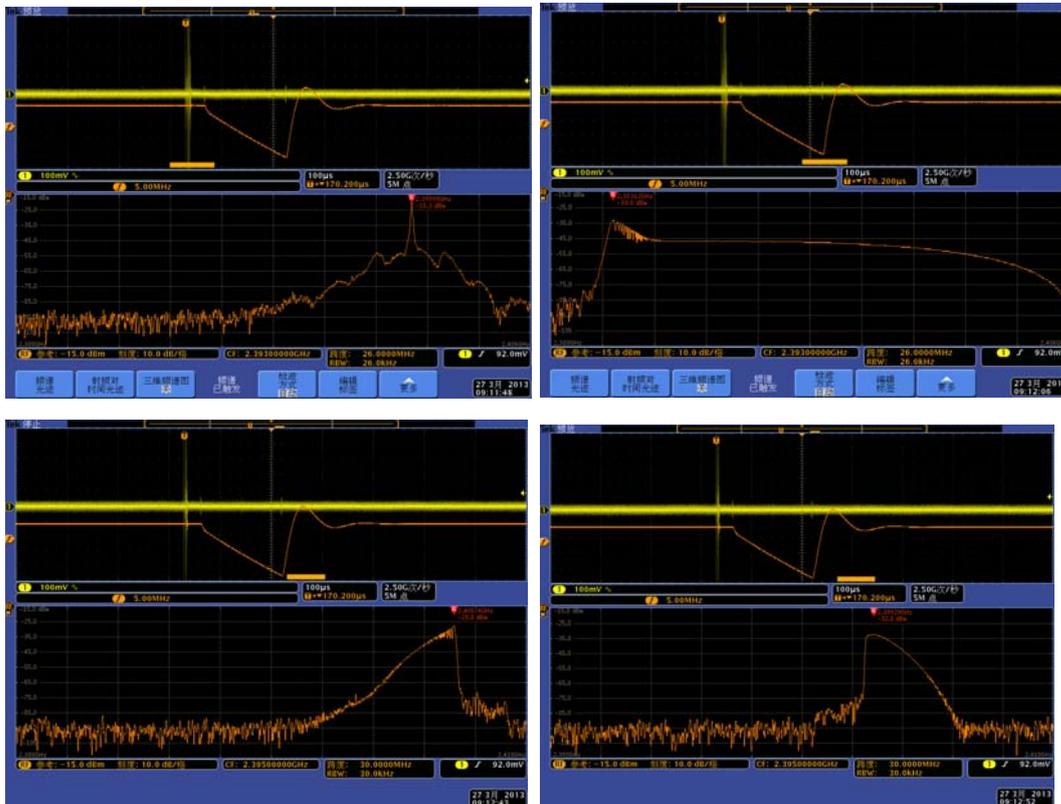


虽然在按压控制面板时 FSK 发射装置的电源上有干扰毛刺，我们如何判断这个干扰就是引起误码的根源？MDO 独特的跨域分析功能，跨域很好地将 2.4GHz 射频信号与电源毛刺关联起

来。我们用 MDO 示波器通道 1 的电源毛刺做触发，同时采集 2.4GHz 载波，并在时域中显示 2.4GHz 载波的频率随时间变化的波形，得到如下结果：



由测试结果可以看出，电源毛刺出现后，2.4GHz 载波的频率随之发生畸变，其变化的波形与 RSA5106 所测试的波形相同，持续时间都是 470uS 左右。调整上图上半部分代表频谱分析时间窗的橙色条在时间轴上的位置，我们可以看到 2.4GHz 载波频谱变化的过程：



通过这一测试，我们可以断定引起 FSK 发射装置误码的根源就是按压大型设备控制按键所造成的传导 EMI 干扰问题，只需在 FSK 发射装置电源上适当滤波，就很容易解决。

案例总结：

本案充分展现了 EMI 诊断与 EMI 预认证的关系。泰克实时频谱仪相当于 EMI 预认证测试仪，该仪表具有发现瞬态 EMI 的优势，并且能够测试 EMI 的影响。即使如此高端的频谱仪，也无法追踪 EMI 的真正来源。MDO 跨域分析特性，轻松诊断出该 EMI 与电源瞬态波动的关系，顺利地追踪到 EMI 的根源。